



## 高精度光辐射标准探测器空间响应均匀性测量系统和方法

文献类型: 专利

.....

**作者** 吴浩宇<sup>1</sup>; 王骥<sup>1</sup>; 郑小兵<sup>1</sup>

**发表日期** 2008

**专利国别** 中国

**专利号** 101097169

**专利类型** 发明

**权利人** 中国科学院安徽光学精密机械研究所

**公开日期** 2013-01-10

**申请日期** 2007

**专利申请号** 200710020403.2

**源URL** [http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/9671]

**专题** 合肥物质科学研究院\_中科院安徽光学精密机械研究所

**推荐引用方式** 吴浩宇,王骥,郑小兵. 高精度光辐射标准探测器空间响应均匀性测量系统和方法, 高精度光辐射标准探测器空间响应均匀性测量系统和方法, 高精度光辐射标准探测器空间响应均匀性测量系统和方法, 高精度光辐射标准探测器空间响应均匀性测量系统和方法, 高精度光辐射标准探测器空间响应均匀性测量系统和方法, 高精度光辐射标准探测器空间响应均匀性测量系统和方法, 高精度光辐射标准探测器空间响应均匀性测量系统和方法, 高精度光辐射标准探测器空间响应均匀性测量系统和方法, 高精度光辐射标准探测器空间响应均匀性测量系统和方法, 高精度光辐射标准探测器空间响应均匀性测量系统和方法. 101097169. 2008-01-01.

入库方式: OAI收割

来源: [合肥物质科学研究院](#)

浏览	下载	收藏
210	90	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

